INFORMATION
SCIENCE
TECHNICAL
REPORT

NAIST-IS-TR2002002
ISSN 0919-9527

固定制御可検査性に基づくRTL回路の非スキャンテスト容易化設計法

永井慎太郎，和田弘樹，大竹哲史，藤原秀雄

January 2002

NAIST

〒 630-0101
奈良県生駒市高山町 8916-5
奈良先端科学技術大学院大学
情報科学研究科

Graduate School of Information Science
Nara Institute of Science and Technology
8916-5 Takayama, Ikoma, Nara 630-0101, Japan